



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110324000F
2012 年 2 月 3 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

美浦工場製品 代替工場追加のご案内
(既報 922 製品からの対象除外 54 製品の連絡)

(第二版 PCN20110324000E 2011 年 12 月 2 日発行, 初版 PCN20110324000 2011 年 3 月 25 日発行)

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

既にお知らせさせていただきましたように、昨年発生した日本での大震災は、TI の美浦工場（東京の北東 40 マイル (64Km), 茨城県）へ大きな被害を招きました。美浦工場は 2011 年 4 月 12 日に幾つかの生産ラインを再開し、全面出荷開始となるフル稼働へ向けて同年 7 月 31 日に生産能力を復帰しました。

お客様への供給を継続する為に、多くの美浦工場の代替追加製造工場を検討しました。TI のお客様に対する供給不足を最小限にする為に、この通知内で明記いたしました基本的な工程技術(ウェハプロセス)について既に認定されている工場への速やかに生産移管を実施しました。

基本的な工程技術としてカバーされていない部品(素子)を含む掲載製品の少数の製品種に関しましては、代替の生産工場からの製品出荷を確実なものにする為に、並行して部品(素子)レベルの認定試験を行う予定です。TI は現行 最善の情報/知識に基づき生産移管に必要な全てを本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、再度変更が明確になった場合、本通知の更新にて連絡させていただきます。

各生産拠点での認定状況を基に生産拠点選定および部品(素子)レベルの認定試験による前述の移管施策に加え、TI はお客様への製品納入に先立ち、追加の部品(素子)レベルのパラメータの同一性評価および選別工程での歩留まり/選別分類比較評価を行う事でお客様での懸念事項の払拭に向け進めてまいります。TI は供給の遅れを最小限にとどめると共に、品質を伴った製品の供給に努めてまいります。

次ページに詳細を掲載いたしました。供給遅延を最小限にとどめる為に、TI は部材供給可能な代替工場での生産出荷を 2011 年 4 月に開始いたしております。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	下記変更について既報 922 製品からの対象除外 54 製品の連絡になります。 美浦工場製品 代替工場追加 現行 : TI-MIHO(Japan) 変更後 : TI-MIHO(Japan), ☒ TI-FFAB(Freising), TI-HIJI(Japan), ☒ TI-RFAB(Dallas) ☒ TI-DMOS5(Dallas), UMC(Taiwan), ☒ Dongbu(Korea), ☒ SMIC-TJ(China)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	-			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について既報922製品からの対象除外54製品の連絡になります。これら対象除外品は、引き続きTI-MIHOサイトにて製造します。

弊社 TI-MIHO工場(日本)製造製品について、TI-MIHO工場の一時的な製造停止により対象製品について代替製造サイトの追加の連絡になります。下表に代替追加サイトを掲載し、対応した製品リストにつきましては対象製品の項をご参照下さい。代替製造サイトへの製品追加移管につきましては直ちに実施開始の予定です。製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理工程	TI-MIHO (Japan)	TI-MIHO (Japan), TI-FFAB (Freising), TI-HIJI (Japan), TI-RFAB (Dallas), TI-DMOS5 (Dallas), UMC (Taiwan), Dongbu (Korea), SMIC-TJ (China)

理由：供給能力確保の為

Miho Process MIHO 工場 工程技術	Additional Site 代替追加サイト	Device Table 対象製品リスト表
A07S	SMIC-TJ	Table 1
A12	FFAB	Table 2
C18	HIJI	Table 3
Bicom	FFAB	Table 4
LBC7	UMC, RFAB, FFAB	Table 5
A07S (DLP products)	DMOS5	Table 6
A07S (DLP products)	Dongbu	Table 7
LBC7 (DLP products)	DMOS5	Table 8

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)および生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)およびラベル上の表示位置は、下記のようになります。

Manufacturing Site	Chip Site 前処理サイト	Chip site code (20L) 前処理サイト記号	Chip country code (21L) 生産国記号
現行	MIHO6	MH6	JPN
	MIHO8	MH8	JPN
追加認定	RFAB	RFB	USA
	FR-BIP-1	TID	DEU
	UMC-F8AB	UAB	TWN
	HIJI	HIJ	JPN
	SMIC-TJ	SMT	CHN
	DMOS5	DM5	USA
	Dongbu (ANAM-1)	ANM	KOR



図1 出荷ラベルの例

対象製品リスト

対象製品名 Table 1 (A07 Devices - SMIC-TJ)				
□: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
BQ24100RHLR	BQ24113ARHLR	BQ24123RHLR	TL16C550DIPFBG4	TL16C550DPTG4
BQ24100RHLRG4	BQ24113ARHLRG4	BQ24123RHLRG4	TL16C550DIPFBR	TL16C550DPTR
BQ24103ARHLR	BQ24113ARHLT	BQ24123RHILT	TL16C550DIPFBG4	TL16C550DPTRG4
BQ24103ARHLRG4	BQ24113ARHLTG4	BQ24123RHILTG4	TL16C550DIPIT	TLC2932AIPW
BQ24103ARHLT	BQ24113RHLR	BQ24125RHLR	TL16C550DIPITG4	TLC2932AIPWG4
BQ24103ARHLTG4	BQ24113RHLRG4	BQ24125RHLRG4	TL16C550DIPTR	TLC2932AIPWR
BQ24103RHLR	BQ24115RHLR	BQ24125RHILT	TL16C550DIPTRG4	TLC2932AIPWRG4
BQ24103RHLRG4	BQ24115RHLRG4	BQ24125RHILTG4	TL16C550DPFB	TLC2933AIPW
BQ24105RHLR	BQ24120RHLR	HPA00138RHLR	TL16C550DPFBG4	TLC2933AIPWG4
BQ24105RHLRG4	BQ24120RHLRG4	HPA00241RHLR	TL16C550DPFBR	TLC2933AIPWR
BQ24108RHLR	BQ24120RHILT	HPA00610RHLR	TL16C550DPFBG4	TLC2933AIPWRG4
BQ24108RHLRG4	BQ24120RHILTG4	TL16C550DIPFB	TL16C550DPT	

対象製品名 Table 2 (A12 Devices - FFAB)				
□: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
BQ24027DRCR	BQ24070RHLRG4	HPA00186ARHLR	TPS3803-01MDCKREP	TPS61045DRBRG4
BQ24027DRCRG4	BQ24070RHILT	HPA00212DBVR	TPS3803-01QDCKREP	TPS61045DRBT
BQ24027DRCT	BQ24070RHILTG4	HPA00240RHLR	TPS61040DBVR	TPS61045DRBTG4
BQ24027DRCTG4	BQ24080DRCR	HPA00247DRBR	TPS61040DBVRG4	V62/04648-01XE
BQ24032ARHLR	BQ24080DRCRG4	HPA00483DRBR	TPS61040DDCR	V62/04648-04XE
BQ24032ARHLRG4	BQ24080DRCT	SN412005RHLR	TPS61040DDCT	VSP2246PFB
BQ24032ARHLT	BQ24080DRCTG4	SN412005RHLRG4	TPS61042DRBR	VSP2246PFBG4
BQ24032ARHLTG4	BQ25010RHLR	SN412030DRCR	TPS61042DRBRG4	VSP2246PFBRR
BQ24035RHLR	BQ25010RHLRG4	SN412030DRCRG4	TPS61042DRBT	VSP2246PFBRG4
BQ24035RHLRG4	HPA00152RHLR	TLV320AIC22CPT	TPS61042DRBTG4	
BQ24070RHLR	HPA00172RHLR	TLV320AIC22CPTR	TPS61045DRBR	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品名 Table 3 (C18 Devices - HIJI)	
□: 既報対象品	
V62/03616-01XE	V62/03616-02XE

対象製品名 Table 4 (Bicom Devices - FFAB)			
□: 既報対象品			
PSR3411A6ZYR	PSR3471BAA4YZ	SR3471ADA6YZ	XSR3411A6ZYZ
PSR3471ADA6YZ	SR3411A6ZYR	SR3471BAA4YZ	XSR3411A6ZYR

対象製品名 Table 5 (LBC7 Devices - UMC, RFAB, FFAB)				
□: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
9162AAAPHPG4-MC	PBQ24040DSQR	SN69035A1DCAR	TPS51200DRCR	TPS65251RHAT
BQ2022ADBZR	PBQ24040DSQT	SN6C053A1DAP	TPS51200DRCR/2801	TPS65255RHA
BQ2022ADBZRG4	PCM5310PAP	SN6C053A1DAPR	TPS51200DRCRG4	TPS65255RHAR
BQ2022ALPR	PCM5310PAPR	SN76029APWPR	TPS51200DRCT	TPS65255RHAT
BQ2022ALPRE3	PDRV8830A0DGQ	SN7C026BORGER	TPS51200DRCTG4	TPS65255RHD
BQ2024DBZR	PDRV8830A1DGQ	SN84004RGFT	TPS51220ARSNR	TPS65255RHDT
BQ2024DBZRG4	PDRV8832A0DGQ	SN88077A0DCAR	TPS51220ARSNT	TPS65257RHA
BQ2026LP	PDRV8832A1DGQ	SN89019A3RSLR	TPS51220ARTVR	TPS65257RHAR
BQ2026LPR	PPAD1000A0YFFR	SN89044A0DCAR	TPS51220ARTVR/2801	TPS65257RHAT
BQ24040DSQR	PPCM5310PAP	SN89044A2Q/E99	TPS51220ARTVT	TPS65258RHA
BQ24040DSQT	PPCM5310PAPR	SN92009A4RGZR	TPS51220RHBR	TPS65258RHAR
BQ24041DSQR	PPS65185A1RGZR	SN94005R00ZCBR	TPS51220RHBRG4	TPS65258RHAT
BQ24041DSQT	PPS65185A1RSLR	SN95023A2YZDR	TPS51220RHBT	TPS65830YFFR
BQ24052DSQR	PPS65185A2RGZR	SN96005RSLR	TPS51220RHBTG4	TPS658621AZGUR-1
BQ24052DSQT	PPS65185A2RSLR	SN96005YFFR	TPS51221RTVR	TPS658621AZGUT-1
BQ24055DSSR	PPS65186A1RGZR	SN9B047A1RTQR	TPS51221RTVRG4	TPS658621CZGUR
BQ24055DSSST	PPS65186A2RGZR	SNA3070AZQER	TPS51221RTVT	TPS658621CZGUT
BQ24072RGTR	PPS65200A2YFFR	SNA6044DCAR	TPS51221RTVTG4	TPS658621CZQZR
BQ24072RGTRG4	PPS65210A0RHBR	SNA9007RHBR	TPS51222RSNR	TPS658621CZQZT
BQ24072RGTT	PPS65210A0RHDR	SNA9034A2RSLR	TPS51222RSNT	TPS658621DZGUR
BQ24072RGTTG4	PPS65240A1DCA	SNA038AYFF	TPS51222RTVR	TPS658621DZGUT
BQ24072TRGTR	PPS65241A0DCA	SNA038AYFFR	TPS51222RTVT	TPS658621DZQZR
BQ24072TRGTT	PPS65255A0RHA	SNAB043A1YFF	TPS51316RUWR	TPS658621DZQZT
BQ24073RGTR	PPS65255A0RHD	SNAB043A1YFFR	TPS51317RGR	TPS658622AZQZR
BQ24073RGTRG4	PPS65257A0RHA	TLC591161PWR	TPS51317RGBT	TPS658622AZQZT
BQ24073RGTT	PPS65257A0RHAT	TLC591161PWRG4	TPS51318RUWR	TPS658622BZQZR
BQ24073RGTTG4	PPS65258A0RHA	TLC591161RHBR	TPS51318RUWT	TPS658622BZQZT
BQ24074RGTR	PPS65258A0RHAT	TLC59224F1DBTR	TPS51601DRBR	TPS658623ZGUR
BQ24074RGTRG4	PPS65270A0PWP	TLC59251DBQR	TPS51601DRBT	TPS658623ZGUT
BQ24074RGTT	PPS65270A0PWPR	TLC59251DBQRG4	TPS51980RTVR	TPS658623ZQZR
BQ24074RGTTG4	PPS65270A0RGER	TLC59251DWR	TPS53200DSQR	TPS658623ZQZT
BQ24075RGTR	PPS65270A0RGET	TLC59251DWRG4	TPS53200DSQT	TPS658624ZQZR
BQ24075RGTRG4	PSC84004A0RGF	TLC59251PWR	TPS53314RGFMC	TPS658624ZQZT
BQ24075RGTT	PSC84004A0RGFR	TLC59251PWRG4	TPS53315RGFRMC	TPS658640ZGUR
BQ24075RGTTG4	PSC84004A0RGFT	TLC5929DBQ	TPS53315RGFTMC	TPS658640ZGUT
BQ24075TRGTR	PSN0601025BZQZRG1	TLC5929DBQR	TPS53317RGR	TPS658640ZQZR
BQ24075TRGTT	PSN0904005A3A1ZCBR	TLC5929DBQT	TPS53317RGBT	TPS658640ZQZT
BQ24079TRGTR	PSN1005103RHA	TLC5960DA	TPS53601DRBR	TPS658642ZQZR
BQ24079TRGTT	PSN1005103RHAR	TLC5960DAR	TPS53603DRGR	TPS658642ZQZT
BQ24090DGQR	PSN1102023LP	TLS2322AZRNRG1	TPS53603DRGT	TPS658643ZGUR
BQ24090DGQT	PSN69035A1DCA	TLS2322BZRNRG1	TPS54020RUWR	TPS658643ZGUT
BQ24091DGQR	PSN76029APWP	TLV70015DCKR	TPS54020RUWT	TPS658643ZQZR
BQ24091DGQT	PSN87089A1DCA	TLV70015DCKT	TPS54227DDA	TPS658643ZQZT
BQ24092DGQR	PSN88080A4PFBR	TLV70015DDCR	TPS54227DDAR	TPS658644ZQZR
BQ24092DGQT	PSN89019A3RSLR	TLV70015DDCT	TPS54228DDA	TPS658644ZQZT

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

BQ24093DGQR	PSN89044A0DCA	TLV70015DSE	TPS54228DDAR	TPS659101A1RSL
BQ24093DGQT	PSN8C009B0RGER	TLV70015DSET	TPS54283PWP	TPS659101A1RSLR
BQ24140YFFR	PSN92009A4RGZR	TLV70030DCKR	TPS54283PWPG4	TPS659102A1RSL
BQ24160YFFR	PSN96005RSL	TLV70030DCKT	TPS54283PWPR	TPS659102A1RSLR
BQ24161YFFR	PSN96005YFF	TLV70030DDCR	TPS54283PWPRG4	TPS659103A1RSL
BQ24165YFFR	PSN98044A0RHBR	TLV70030DDCT	TPS54320RHLR	TPS659103A1RSLR
BQ24230RGTR	PSN98044A0RHDR	TLV70030DSE	TPS54320RHLT	TPS659104A1RSL
BQ24230RGTRG4	PSN9B047A1RTQR	TLV70030DSET	TPS54326PWP	TPS659104A1RSLR
BQ24230RGTT	PSN9C006A0YFFR	TLV70507YFFR	TPS54326PWPR	TPS659105A1RSL
BQ24230RGTTG4	PSNA3070BZQE	TLV70507YFFT	TPS54527DDA	TPS659105A1RSLR
BQ24232RGTR	PSNA3070BZQER	TLV70518YFFR	TPS54527DDAR	TPS659106A1RSL
BQ24232RGTRG4	PSNA6044DCA	TLV70518YFFT	TPS54528DDA	TPS659106A1RSLR
BQ24232RGTT	PSNA9007RHB	TLV70528YFFR	TPS54528DDAR	TPS659107A1RSL
BQ24232RGTTG4	PSNAA038AYFF	TLV70528YFFT	TPS60150DRV	TPS659107A1RSLR
BQ24300DSGR	PSNAA038AYFFR	TLV70545YFFR	TPS60150DRV	TPS659108A1RSL
BQ24300DSGRG4	PSNAB043A1YFF	TLV70545YFFT	TPS60151DRV	TPS659108A1RSLR
BQ24300DSGT	PSNAB043A1YFFR	TLV70548YFFR	TPS60151DRV	TPS659109A1RSL
BQ24300DSGTG4	PTLS2322AZRNRG1	TLV70548YFFT	TPS61080DRCR	TPS659109A1RSLR
BQ24304DSGR	PTLS2322BZRNRG1	TLV70707PDQNR	TPS61080DRCRG4	TPS65910A1RSL
BQ24304DSGRG4	PTPA2015D1NYZHR	TLV70707PDQNT	TPS61080DRCT	TPS65910A1RSLR
BQ24304DSGT	PTPIC1385DHDG4	TLV70712PDQNR	TPS61080DRCTG4	TPS71709DSE
BQ24304DSGTG4	PTPIC1385DHDGR4	TLV70712PDQNT	TPS61081DRCR	TPS71709DSE
BQ24313DSGR	PTPIC1386DFDG4	TLV70718PDQNR	TPS61081DRCRG4	TPS71709DSE
BQ24313DSGT	PTPIC1386DFDRG4	TLV70718PDQNT	TPS61081DRCT	TPS71709DSE
BQ24314ADSGR	PTPIC1391DBTG4	TLV70726PDQNR	TPS61081DRCTG4	TPS717185DSE
BQ24314ADSGRG4	PTPIC1391DBTRG4	TLV70726PDQNT	TPS61087DRCR	TPS717185DSE
BQ24314ADSGT	PTPS54227DDA	TLV70728PDCKR	TPS61087DRCRG4	TPS71718DSE
BQ24314ADSGTG4	PTPS54227DDAR	TLV70728PDCKT	TPS61087DRCT	TPS71718DSE
BQ24314DSGR	PTPS54228DDA	TLV70728PDQNR	TPS61087DRCTG4	TPS71718DSE
BQ24314DSGRG4	PTPS54228DDAR	TLV70728PDQNT	TPS61160DRV	TPS71718DSE
BQ24314DSGT	PTPS54326PWP	TLV70730PDQNR	TPS61160DRV	TPS71719DCKR
BQ24314DSGTG4	PTPS54326PWPR	TLV70730PDQNT	TPS61160DRV	TPS71719DCKRG4
BQ24315DSGR	PTPS65830YFFR	TLV70733PDQNR	TPS61160DRV	TPS71727DSE
BQ24315DSGRG4	PTPS659101A1RSL	TLV70733PDQNT	TPS61175PWP	TPS71727DSE
BQ24315DSGT	PTPS659101A1RSLR	TLV70748PDQNR	TPS61175PWPR	TPS71728DSE
BQ24315DSGTG4	PTPS659102A1RSL	TLV70748PDQNT	TPS61181RTER	TPS71728DSE
BQ24316DSGR	PTPS659102A1RSLR	TLV70750PDQNR	TPS61181RTERG4	TPS71728DSE
BQ24316DSGRG4	PTPS659103A1RSL	TLV70750PDQNT	TPS61181RTET	TPS71728DSE
BQ24316DSGT	PTPS659103A1RSLR	TLV707730DBVR	TPS61181RTETG4	TPS71733DSE
BQ24316DSGTG4	PTPS659104A1RSL	TLV707730DBVT	TPS61182RTER	TPS71733DSE
BQ24600RVAR	PTPS659104A1RSLR	TPA2011D1YFFR	TPS61182RTERG4	TPS71733DSE
BQ24600RVAT	PTPS659105A1RSL	TPA2011D1YFFT	TPS61182RTET	TPS71733DSE
BQ24610RGER	PTPS659105A1RSLR	TPA2013D1RGPR	TPS61182RTETG4	TPS71745DSE
BQ24610RGET	PTPS659106A1RSL	TPA2013D1RGPRG4	TPS61200DRCR	TPS71745DSE
BQ24616RGER	PTPS659106A1RSLR	TPA2013D1RGPT	TPS61200DRCRG4	TPS71750DSE
BQ24616RGET	PTPS659107A1RSL	TPA2013D1YZHR	TPS61200DRCT	TPS71750DSE
BQ24617RGER	PTPS659107A1RSLR	TPA2013D1YZHT	TPS61200DRCTG4	TPS720105YZUR
BQ24617RGET	PTPS659108A1RSL	TPA2014D1RGPR	TPS61201DRCR	TPS720105YZUT
BQ24618RGER	PTPS659108A1RSLR	TPA2014D1RGPRG4	TPS61201DRCRG4	TPS72012YZUR
BQ24618RGET	PTPS659109A1RSL	TPA2014D1RGPT	TPS61201DRCT	TPS72012YZUT
BQ24620RVAR	PTPS659109A1RSLR	TPA2014D1RGPTG4	TPS61201DRCTG4	TPS72013YZUR
BQ24620RVAT	PTPS65910A1RSL	TPA2014D1YZHR	TPS61202DRCR	TPS72013YZUT
BQ24630RGER	PTPS65910A1RSLR	TPA2014D1YZHT	TPS61202DRCRG4	TPS72015YZUR
BQ24630RGET	PTPS659110AZRC	TPA2015D1NYZHT	TPS61202DRCT	TPS72015YZUT
BQ24640RVAR	PTPS659110AZRCR	TPA2028D1YZFR	TPS61202DRCTG4	TPS72017YZUR
BQ24640RVAT	PTPS659112AZRC	TPA2028D1YZFT	TPS61500PWP	TPS72017YZUT

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

BQ24707ARGRR	PTPS659112AZRCR	TPA2037D1YFFR	TPS61500PWR	TPS72018YZUR
BQ24707ARGRT	PTPS659113AZRC	TPA2037D1YFFT	TPS62110MRSAREP	TPS72018YZUT
BQ24741RHDR	PTPS659113AZRCR	TPA2038D1YFFR	TPS62111MRSAREP	TPS72021YZUR
BQ24741RHDT	PTPS65911AZRC	TPA2039D1YFFR	TPS62112MRSAREP	TPS72021YZUT
BQ24742RHDR	PTPS65911AZRCR	TPA2039D1YFFT	TPS62130RGTR	TPS72711YFFR
BQ24742RHDT	PTPS80010A1RSM	TPA6136A2YFFR	TPS62130RGTT	TPS72711YFFT
BQ24745RHDR	PTPS80010A1RSMR	TPA6136A2YFFT	TPS62131RGTR	TPS72712YFFR
BQ24745RHDRG4	PTPS80100A1YFF	TPIC1386DBTRG4	TPS62131RGTT	TPS72712YFFT
BQ24745RHDT	PTPS80100A1YFFR	TPIC1386DFDRG4	TPS62132RGTR	TPS72715YFFR
BQ24745RHDTG4	SC62091A5PAP	TPIC1391DBTRG4	TPS62132RGTT	TPS72715YFFT
BQ24747RHDR	SC84004RGFT	TPS22924BYZPR	TPS62133RGTR	TPS727185YFFR
BQ24747RHDT	SC85030A3RSLR	TPS22924CYZPR	TPS62133RGTT	TPS727185YFFT
BQ24765RUVR	SC89019A3RSLR	TPS22924CYZPT	TPS62140RGTR	TPS72718YFFR
BQ24765RUVT	SN0803054DRCR	TPS2358RGZR	TPS62140RGTT	TPS72718YFFT
BQ24766RUVR	SN0803054DRCRG4	TPS2358RGZRG4	TPS62141RGTR	TPS727285YFFR
BQ24766RUVT	SN0807052D	TPS2358RGZT	TPS62141RGTT	TPS727285YFFT
BQ24767RUVR	SN0807052DG4	TPS2358RGZTG4	TPS62142RGTR	TPS72728YFFR
BQ24767RUVT	SN0807052DR	TPS2359RHHR	TPS62142RGTT	TPS72728YFFT
BQ25050DQCR	SN0807052DRG4	TPS2359RHHRG4	TPS62143RGTR	TPS7A7001DDA
BQ25050DQCT	SN0905029RUWR	TPS2359RHHT	TPS62143RGTT	TPS7A7001DDAR
BQ25060DQCR	SN0905030RUWR	TPS2359RHHTG4	TPS62150RGTR	TPS7A7201RGWR
BQ25060DQCT	SN1003055RUWR	TPS2410PW	TPS62150RGTT	TPS7A7201RGWT
BQ25070DQCR	SN1005103RHA	TPS2410PWG4	TPS62151RGTR	TPS80010ARSM
BQ25070DQCT	SN1005103RHAR	TPS2410PWR	TPS62151RGTT	TPS80010ARSMR
BQ33200ZGVRMC2	SN1005103RHAT	TPS2410PWR/2801	TPS62152RGTR	TPS92070PW
DRV8830DGQ	SN1008033RHA	TPS2410PWRG4	TPS62152RGTT	TPS92070PWR
DRV8830DGQR	SN1008033RHAR	TPS2411PW	TPS62153RGTR	TPS92221D
DRV8832DGQ	SN1008033RHAT	TPS2411PWG4	TPS62153RGTT	TPS92221DR
DRV8832DGQR	SN1008034RHA	TPS2411PWR	TPS62262DDCR	UCC28061D
DRV91620PHP-MC	SN1008034RHAR	TPS2411PWRG4	TPS62262DDCT	UCC28061DG4
FICAROSB1Y	SN1008034RHAT	TPS2412D	TPS63010YFFR	UCC28061DR
HPA00321YZHR	SN1010017RSAR	TPS2412DG4	TPS63010YFFT	UCC28061DRG4
HPA00388RTER	SN1011005RHA	TPS2412DR	TPS65001RUKR	UCC28063D
HPA00460YZUR	SN1011005RHAR	TPS2412DRG4	TPS65001RUKT	UCC28063DR
HPA00461YZUR	SN1011005RHAT	TPS2412PW	TPS650061RUKR	UCC28070DW
HPA00485YZUR	SN1012008YZFR	TPS2412PWG4	TPS650061RUKT	UCC28070DWR
HPA00495YZHR	SN1101002DDA	TPS2412PWR	TPS65180BRGZR	UCC28070PW
HPA00497RGPR	SN1101002DDAR	TPS2412PWRG4	TPS65180BRGZT	UCC28070PWG4
HPA00512DRCR	SN1101003DDA	TPS2413D	TPS65181BRGZR	UCC28070PWR
HPA00649DBZR	SN1101003DDAR	TPS2413DG4	TPS65181BRGZT	UCC28070PWRG4
HPA00689YZUT	SN1101004DDA	TPS2413DR	TPS65182BRGZR	UCD7231RTJR
HPA00690YZUT	SN1101004DDAR	TPS2413DRG4	TPS65182BRGZT	UCD7231RTJT
HPA00716DR	SN1101005DDA	TPS2413PW	TPS65185RGZR	UCD7242RSJR
HPA00716PWR	SN1101005DDAR	TPS2413PWG4	TPS65185RGZT	UCD7242RSJT
HPA00756D1RGPR	SN1102023LP	TPS2413PWR	TPS65185RSLR	V62/07622-01XE
HPA00802DRCR	SN239089ADBZR	TPS2413PWRG4	TPS65185RSLT	V62/07622-02XE
HPA00810-1/2	SN239089ADBZRG4	TPS2420RSAR	TPS65185SRGZR	V62/07622-03XE
HPA00810RGTR-1/2	SN239089AY	TPS2420RSAT	TPS65186RGZR	XTLC5960DA
HPA00846RSJR	SN239089DBZR	TPS2458RHBR	TPS65186RGZT	XTPIC2050DFDG4
HPA00846RSJT	SN239089DBZRG4	TPS2458RHBT	TPS65200YFFT	XTPS54227ADDA
HPA00899RTER	SN239089Y	TPS2459RHBR	TPS65241AODCA	XTPS54228ADDA
HPA00910YZFR	SN249089DBZR	TPS2459RHBT	TPS65241AODCAR	XTPS54527DDAR
HPA00921RUVR	SN249089DBZRG4	TPS50601SHKH	TPS65251ARHAR	XTPS54528DDAR
HPA01051RGZR	SN62091A5PAP	TPS50601SKGD	TPS65251ARHAT	
HPAPS004ADBZR	SN69035A1DCA	TPS51200DRC/2801	TPS65251RHAR	

対象製品名 Table 6 (DLP A07S Devices - DMOS5) □: 既報対象品				
1076-601AB	1076-6039B	1076E6038B	DLP5500FYA	DLP5500FYAT
1076-6038B	1076-632AW	1076N6039B	DLP5500FYACM	

対象製品名 Table 7 (DLP A07S Devices - Dongbu) □: 既報対象品			
1076-601AB	1076-632AW	1272-6038B	DLP5500FYA
1076-6038B	1076E6038B	1280-6038B	DLP5500FYACM
1076-6039B	1076N6039B	1280-6039B	DLP5500FYAT

対象製品名 Table 8 (DLP LBC7 Devices - DMOS5) □: 既報対象品				
1191-403BC	1910-6127	1910C6137	6845-203BD	X1191-403BT
1191-403BT	1910-6137	3664-203BT	X1191-403BC	X6845-203BD

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 10 月 6 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS51217DSC	-	-	
Wafer Fab Site:	RFAB	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Char.	-	Approved	Approved	Approved
Latch-up	per JESD78	6/0	6/0	6/0
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Post Temp Cycle SAM	CSAM and TSAM analysis after 1000 cycles Temp cycle	Approved	Approved	Approved
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Wafer Fab MQ	Per site spec	Approved	-	-
Assembly / Test MQ	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	Approved	-	-
High Temp. Storage Bake	170C,168, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C,500, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Steady-state Life Test	135C,110, 320, 635 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Preconditioning: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 7 月 9 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SH6125BAC0PAPG4	-	-	
Wafer Fab Site:	UMC-F8AB	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	125C,1000hrs or equivalent	77/0	-	-
Electrical Char	Per datasheet spec	Approved	Approved	Approved
**High Temp. Storage Bake	170C,420hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C,500 Cyc	77/0	77/0	77/0
ESD CDM	+/- 500V	3/0	3/0	3/0
ESD HBM	+/- 2000V	3/0	3/0	3/0
Wafer level Reliability	Approved	Approved	Approved	Approved
Latch-up	1.5xVcc/25C/250mA	6/0	6/0	6/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	65C/150C,500 Cyc	77/0	77/0	77/0
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 10 月 31 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qualification Device:	TCA6416PW	-		-	
Wafer Fab Site:	FFAB: FR-BIP-1	Wafer Fab Process:		LBC7	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
** Steady-State Life Test	150C,300 Hrs	116/0	116/0	116/0	
**Biased HAST	130C/85%RH,96 hours	77/0	77/0	77/0	
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
**High Temp. Storage Bake	150C,1000 Hours	77/0	77/0	77/0	
ESD HBM	2000V	3/0	-	-	
ESD MM	100V	3/0	-	-	
ESD CDM	500V	3/0	-	-	
Latch-up	per JESD78, Class II	9/0	-	-	
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0	
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C					

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2003 年 6 月 18 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qualification Device:	TPS65010	-		-	
Wafer Fab Site:	FFAB: FR-BIP-1	Wafer Fab Process:		3370A12	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
** Steady-State Life Test	150C,300 Hrs	120/0	120/0	120/0	
**Biased HAST	130C/85%RH,96 hours	80/0	80/0	80/0	
**Autoclave	121C,96 Hrs	80/0	80/0	80/0	
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	80/0	80/0	80/0	
**Thermal Shock	-65C/150C,1000 Cycles	80/0	80/0	80/0	
** Storage Life	170C,420 Hrs	50/0	50/0	50/0	
ESD HBM	2000V	3/0	-	-	
ESD CDM	500V	3/0	-	-	
Latch-up	per JESD78, Class II	5/0	5/0	5/0	
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C					

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 4 月 5 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qualification Device:	SR3100AAA2PM	-		-	
Wafer Fab Site:	FFAB: FR-BIP-1	Wafer Fab Process:		Bicom-3XL	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
** Steady-State Life Test	125C,1000 Hrs	116/0	116/0	116/0	
** Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0	
ESD MM	100V	3/0	3/0	3/0	
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0	
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C					

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 2 月 20 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TWL3029FZQW	-	-	
Wafer Fab Site:	SMIC	Wafer Fab Process:	3370A07S	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
** Steady-State Life Test	1000 Hrs	116/0	116/0	116/0
**Biased HAST	130C/85%RH 96 hours	26/0	26/0	26/0
**Autoclave	121C,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Life	150C,600 Hours	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Latch-up	per JESD78, Class II	5/0	5/0	5/0
**Thermal Shock	200 Cycles	77/0	77/0	77/0
Electrical Char	approved by product engineering	Approved	Approved	Approved
Manufacturability	approved by mfg. site	Approved	Approved	Approved
** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 4 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TMS320C32PCM40	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJI	Wafer Fab Process:	50C18	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Autoclave	121C,240 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Bake	150C,1000 Hours	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	2000V	3/0	-	-
Latch-up	per JESD78, Class II	5/0	-	-
**Thermal Shock	200 Cycles	75/0	72/0	72/0
** Preconditioning				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 9 月 27 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	1076-632AW	-	-	
Wafer Fab Site:	DMOS5	Wafer Fab Process:	A07	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
ESD HBM	+/-2.0 kV	9/0		
Device Characterization	Test Program versus device specification	15/0		
Optical Characterization	Contrast and Color Point	3/0		
Image Quality Evaluation	Projected Image versus Specification	30/0		
CMOS Latch-up	+/-250 mA per I/O, 2.0Vccmax at room temperature	14/0		

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2006 年 11 月 30 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qualification Device:	SN0402067DW		-	-	
Wafer Fab Site:	DMOS5		Wafer Fab Process:	3370A07S	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
**Life Test	140C,1000hrs	77/0	77/0	77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**High Temp. Storage	150C,1000hrs	77/0	77/0	77/0	
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
**Thermal Shock	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
ESD HBM	+/- 2000V – Excl Sensor Pins	3/0	3/0	3/0	
ESD CDM	+/- 500V– Excl Sensor Pins	3/0	3/0	3/0	
ESD MM	+/- 100V– Excl Sensor Pins	3/0	3/0	3/0	
Latch-up	100mA	6/0	6/0	6/0	
Electrical Char	Per datasheet spec	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C					

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2006 年 11 月 30 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qualification Device:	SN0302019PW		-	-	
Wafer Fab Site:	DMOS5		Wafer Fab Process:	3370A07S	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	76/0	77/0	77/0	
**Autoclave	121C,240 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
**Thermal Shock	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
**High Temp. Storage	175C,1000hrs	77/0	77/0	77/0	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved			
Wafer level Reliability	Approved	Approved	Approved	Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C					

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 2 月 16 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qualification Device:	BQ24721RHB	-		-	
Wafer Fab Site:	DMOS5	Wafer Fab Process:		LBC7	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
**High Temp. Storage	170C,420hrs	77/0	77/0	77/0	
**Autoclave	121C,240 Hrs	77/0	77/0	77/0	
**Temp Cycle	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
**Thermal Shock	-65C/150C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0	
ESD HBM	+/- 2000V	3/0	3/0	3/0	
ESD CDM	+/- 500V	3/0	3/0	3/0	
ESD MM	+/- 100V	3/0	3/0	3/0	
Latch-up	100mA	5/0	5/0	5/0	
Electrical Char	Per datasheet spec	Approved	Approved	Approved	
Wafer level Reliability	Approved	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C					

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 2 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	SH6964BBA0G4	-	-	
Wafer Fab Site:	DMOS5	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Biased HAST	130C/85%RH,96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved		
Wafer level Reliability	Approved	Approved	Approved	Approved
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2007 年 2 月 16 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	BQ24730RGF	-	-	
Wafer Fab Site:	DMOS5	Wafer Fab Process:	LBC7	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	155C,240 Hrs	116/0	116/0	116/0
Electrical Char	Per datasheet spec	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved		
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved		
Wafer level Reliability	Approved	Approved	Approved	Approved
** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 6 月 11 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	Victoria2	-	-	
Wafer Fab Site:	Dongbu (ANAM-1)	Wafer Fab Process:	A07S	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Biased HAST	130C/85%RH,192 Hrs	77/0	76/0	76/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-55C/125C,1000 Cycles	77/0	85/0	77/0
**T/C	-55C/125C,1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
** Life Test	125C,1000 Hrs	116/0	116/0	116/0
High Temp. Storage Bake	150C,1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
Electrical Char.	-	Approved	Approved	Approved
ESD HBM	1500V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	5/0	5/0	5/0
Latch-up	-	8/0	8/0	8/0
**Preconditioning: JEDEC L-3/245C				

Appendix A – Associated capacity transfers

Site	Process	PCN Number
RFAB	C05	20110104000
RFAB	LBC7	20100712000
UMC	LBC7	20100428001
UMC	LBC7	20100827001
UMC	LBC5	20100907000
Aizu	33HPA07	20101118001
Aizu	50HPA07	20101118002